

## SOCKETS DE TEST HAUTE PERFORMANCE

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des sockets de test à travers les marques Synergetix et Antares, IDI a su rester à la pointe de la technologie grâce à une innovation constante et à des produits innovants et performants

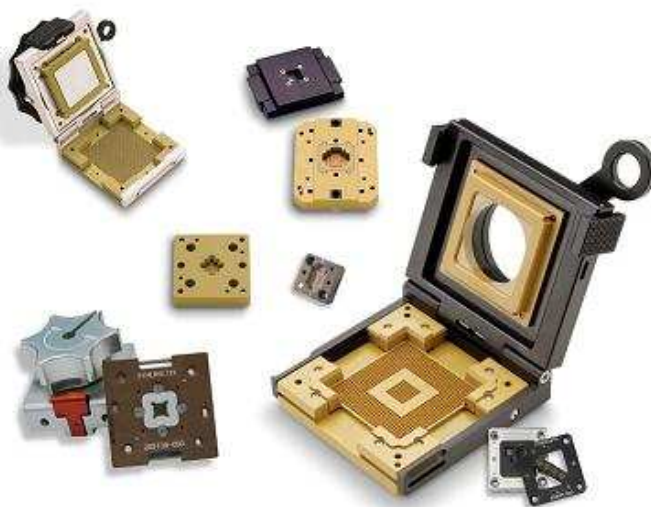
La maîtrise à la fois de l'usinage des sockets de test et des contacts à ressort permet à IDI de proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque application, que ce soient les hautes performances de la R&D ou une grande fiabilité pour la production. Les matériaux et les contacts sélectionnés assurent une stabilité dimensionnelle et offrent les meilleures performances électriques, faible résistance et bande passante supérieure à 10 GHz.

### CSP, BGA et LGA Socket :

Les sockets IDI pour CSP, BGA et LGA équipés de contacts à ressorts (probes) offrent de hautes performances en haute fréquence, avec des faibles résistances de contact et une faible inductance.

Cela répondra à toutes vos demandes de test haute performance et caractérisations...

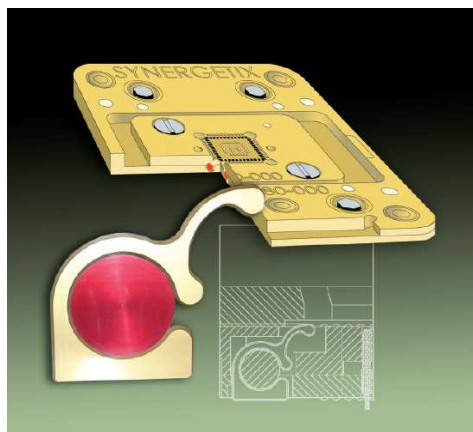
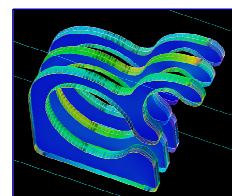
Nous utilisons des contacts à ressorts et autres technologies alternatives dans un support fixe ou flottant, dont le design dépendra de vos caractéristiques produits. Nos sockets de test sont toujours CUSTOM afin de s'adapter au mieux à votre produit



### Dyno Socket :

Pour les composants type QFN et TQFP, IDI a breveté un contact novateur permettant de traverser les contaminants et oxydes des composants. Ce contact offre des performances accrues en nombre de cycles, possède une force de compression élevée de 40 à 85 gr, son action auto-nettoyante limite les maintenances, plages de température d'utilisation élevée. Disponible pour des pas à partir de 0,4mm.

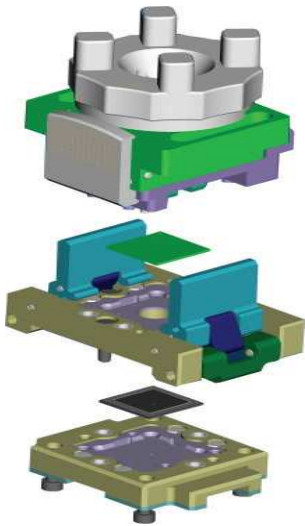
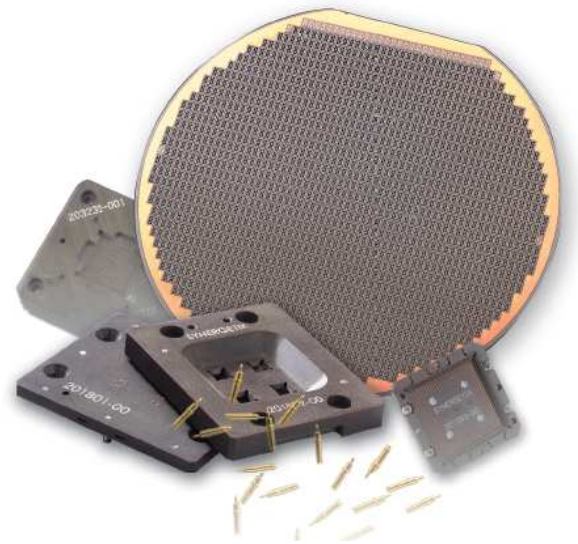
- Contact Autonettoyant
- Nombre de cycles >500,000 insertions
- plage de température -55 à 150°C
- Résistance de contact <20mΩ
- Maintenance et remplacement simplifié



## WLCSP Sockets :

IDI propose pour le test des wafers une solution facile d'entretien, plus robuste, pour un coût 20% inférieur à des moyens conventionnels de type cartes à pointes. Ce socket de test peut être utilisé à la fois pour le test sur le wafer multi-sites jusqu'à 16 empreintes et le test du composant unitaire garantissant ainsi aux ingénieurs une excellente corrélation de mesure.

- Entraxe au pas de 0,4mm
- Solutions Robustes et maintenance aisée
- Réduction de coût
- Sockets multi-sites
- Corrélation de mesure Wafer / Composant
- Délais de livraison de 4 semaines



## POP Sockets :

IDI est depuis de nombreuses années le leader mondial des sockets « Package on Package » et offre des solutions fiables pour le test manuel ou automatisé des composants. L'expertise d'IDI permet d'offrir des produits garantissant un excellent alignement des différents éléments et une compression homogène des contacts.

- Entraxe au pas de 0,4mm dessus / dessous
- Entraxe au pas de 0.25mm pour le développement
- Solutions Manuelles ou automatisées
- Memory Less (ML) ou Memory Bearing (MB)
- Bande fréquence >10GHz
- Excellente intégrité du signal



## Coaxial Sockets :

IDI offre des sockets de test à structure coaxiale garantissant une intégrité du signal optimal. Ces sockets permettent de travailler jusqu'à 20GHz grâce à un élément en cuivre et à l'optimisation des contacts. IDI peut réaliser avec ses logiciels des simulations RF.

- Entraxe à partir de 0,8mm
- 20Ghz @ -0,5dB
- Solutions jusqu'à 30Ghz pour le développement
- Bloc cuivre optimise la dissipation thermique
- Impédance contrôlée selon vos besoins

